

相位差测量仪/轴角度测量仪

产品名称	相位差测量仪/轴角度测量仪
公司名称	苏州千宇光学科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:千宇光学 型号:PLM系列 产地:中国
公司地址	工业园区东旺路8号璨坤智能产业园7B302
联系电话	18036132131

产品详情

PLM-100系列是由苏州千宇光学科技有限公司精心设计研发及生产的一款高精度相位差轴角度测量仪。该设备可解析多层相位差，是对吸收轴角度、快慢轴角度、相位差、偏光度、色度及透过率等进行高精度测量；是结合偏光解析和一般光学特性分析于一体的设备；并提供不同型号，供客户进行选配。

相位差R0/Rth测量差：可以测试0-20000nm的相位差范围；
可实现超低相位差测试，可解析Re为1纳米以内基膜的残留相位差；
高相位差测试，可对离型膜、保护膜等高相位差样品进行检测。

吸收轴角度:采用标准片定标，可实现高精度测量。

慢轴、快轴角度：快轴（慢轴）与基准边的夹角

波长分散性测试：有效评估双折射材料特性

偏光度、色度、透过率

优势：搭载高感度/低噪声光谱仪，可以兼容测试偏光片等光学膜的一般光学特性

我们追求信赖性（国产替代），打破进口设备在光学膜、双折射材料行业中相位差测量的20多年垄断。该设备已通过中国计量用标准片数据匹配，傅里叶变换解析偏振光，数据可靠稳定。可溯源性：可提供

计量检测报告。性可靠，由光学博士团队合力研发，追求国产替代。精心打造的每一台设备出货前都会用国家计量标准片进行检验。